Previous Doc

Next Doc First Hit

Go to Doc#

Collection

L5: Entry 7 of 11

File: JPAB

Dec 24, 1993

PUB-NO: JP405340817A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05340817 A

TITLE: RADIATION THERMOMETER

PUBN-DATE: December 24, 1993

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

AKAMATSU, MASARU MANABE, CHITAYOSHI YANAI, TOSHIYUKI ARAI, AKIO SUZUKI, AKIO

ASSIGNEE - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KOBE STEEL LTD

APPL-NO: JP05038602

APPL-DATE: February 26, 1993

US-CL-CURRENT: 374/121

INT-CL (IPC): G01J 5/00; G01J 5/10

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a small-sized radiation thermometer which can correct the emissivity variation of an object to be measured without moving large parts, such as a reference heat source, etc.

CONSTITUTION: The optical system A1 used for the title thermometer is constituted of a reference heat source 3' which radiates infrared rays against an object 1 to be measured from a prescribed angle, reflecting mirrors 4a and 4b which are arranged in the direction of the reflected rays of the infrared rays radiated from the heat source 3' from the object 1 and condense the infrared rays from the object 1 to a plurality of focal points having different expected solid angles, pyroelectric elements 2a and 2b which are positioned to each focal point of the mirrors 4a and 4b and detect the infrared rays condensed by the mirror 4a and 4b, and a correction circuit 9 which corrects the variation of the emissivity ε of the object 1 based on the infrared ray data at each focal point detected by the elements 2a and 2b. Since the emissivity variation of the object 1 can be corrected without moving large parts, such as the reference heat source 3', etc., when such a constitution is used, the thermometer can be miniaturized as a whole.

COPYRIGHT: (C) 1993, JPO&Japio

Next Doc Go to Doc# Previous Doc

Previous Doc

Next Doc First Hit

Generate Collection

Go to Doc#

L5: Entry 7 of 11

File: JPAB

Dec 24, 1993

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05340817 A

TITLE: RADIATION THERMOMETER

Abstract Text (1):

PURPOSE: To obtain a small-sized radiation thermometer which can correct the emissivity variation of an object to be measured without moving large parts, such as a reference heat source, etc.

Abstract Text (2):

CONSTITUTION: The optical system A1 used for the title thermometer is constituted of a reference heat source 3' which radiates infrared rays against an object 1 to be measured from a prescribed angle, reflecting mirrors 4a and 4b which are arranged in the direction of the reflected rays of the infrared rays radiated from the heat source 3' from the object 1 and condense the infrared rays from the object 1 to a plurality of focal points having different expected solid angles, pyroelectric elements 2a and 2b which are positioned to each focal point of the mirrors 4a and 4b and detect the infrared rays condensed by the mirror 4a and 4b, and a correction circuit 9 which corrects the variation of the emissivity ε of the object 1 based on the infrared ray data at each focal point detected by the elements 2a and 2b. Since the emissivity variation of the object 1 can be corrected without moving large parts, such as the reference heat source 3', etc., when such a constitution is used, the thermometer can be miniaturized as a whole.

Current US Cross Reference Classification (1): 374/121

> Previous Doc Next Doc Go to Doc#

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-340817

(43)公開日 平成5年(1993)12月24日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G 0 1 J 5/00 D 8909-2G

5/10

B 8909-2G

審査請求 未請求 請求項の数4(全 8 頁)

(21)出願番号

特願平5-38602

(22)出願日

平成5年(1993)2月26日

(31) 優先権主張番号 特願平4-50347

(32)優先日

平4(1992)3月9日

(33)優先権主張国 日本(JP) (71)出願人 000001199

株式会社神戸製鋼所

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

(72)発明者 赤松 勝

兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号

株式会社神戸製鋼所西神総合研究地区内

(72)発明者 真鍋 知多佳

兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号

株式会社神戸製鋼所西神総合研究地区内

(72)発明者 柳井 敏志

兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号

株式会社神戸製鋼所西神総合研究地区内

(74)代理人 弁理士 本庄 武男

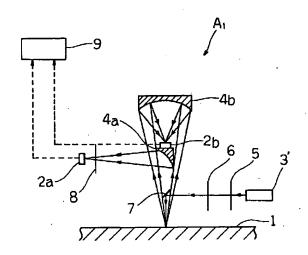
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 放射温度計

(57)【要約】

【目的】 参照熱源などの大物部品を移動させることな く測定対象物の放射率変動を補正できる小型の放射温度

【構成】 この放射温度計用光学系A1 は,測定対象物 1に所定の角度から赤外線を放射する参照熱源3′と, 参照熱源3′から放射された赤外線の測定対象物1での 反射方向に配置され、測定対象物1からの赤外線をその 見込む立体角の異なる複数の焦点に集める反射鏡4a, 4 b と , 反射鏡 4 a , 4 b の 各焦点に配置されて反射鏡 4a, 4bにより集められた赤外線を検出する焦電素子 2a. 2b と、焦電素子2a, 2b により検出された上 記各焦点における赤外線データに基づいて測定対象物1 の放射率 ε の変動を補正する補正回路 9 とから構成され ている。上記構成により、参照熱源などの大物部品を移 動させずに測定対象物1の放射率変動を補正できるた め、装置全体の小型化を図ることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】(1)測定対象物に所定の角度から放射線 を放射する参照熱源と、(2)上記参照熱源から放射さ れた放射線の上記測定対象物での反射方向に配置され、 上記測定対象物からの放射線をその見込む立体角の異な る複数の焦点に集める反射結像手段と、(3)上記反射 結像手段の各焦点に配置されて該反射結像手段により集 められた放射線を検出する放射検出手段と、(4)上記 放射検出手段により検出された上記各焦点における放射

1

源から放射された放射線の上記測定対象物での反射方向 に配置され、上記測定対象物からの放射線を集光して結 像させる反射結像手段と、(3)上記反射結像手段の焦 点に配置されて該反射結像手段により集光された放射線 をその見込む立体角を変化させて受光する放射検出手段 と、(4)上記放射検出手段により検出された上記放射 線データに基づいて上記測定対象物の放射率変動を補正 する補正手段とを具備してなることを特徴とする放射温

【請求項3】 上記放射検出手段が、検出部の位置を切 り換えることのできる受光センサで構成されてなる請求*

$$L_0 = \varepsilon L_b \ (\lambda, T)$$

 $L_1 = \varepsilon L_b (\lambda, T) + (1 - \varepsilon) F (1_1) L_b (\lambda, T_0) \cdots 2$

 $L_2 = \varepsilon L_b (\lambda, T) + (1 - \varepsilon) F (l_2) L_b (\lambda, T_0) \cdots$

※計測とを行うことができる。

線データに基づいて上記測定対象物の放射率変動を補正 10 する補正手段とを具備してなることを特徴とする放射温 度計。 【請求項2】(1)測定対象物に所定の角度から所定幅 の平行放射線を放射する参照熱源と、(2)上記参照熱

度計。

ここで、 ϵ は測定対象物1の放射率、TとT0 はそれぞ れ測定対象物1と参照熱源3の温度, L。(A, T)と 30 L_b (λ, T₀) はそれぞれ温度がTとT₀ での黒体の 放射輝度, F(11)とF(12)はそれぞれ測定対象 物1と参照熱源3までの距離が11と12の時のいわゆ る捕捉率 (測定対象物1に入射された放射線の測定対象 物1の表面での反射線が参照熱源3によって捕捉される 割合)を示す。

【0003】従って、R=F(11)/F(12)とD =F(11)-F(12)との関係を実験的に調べるこ とによりF(11)とF(12)とを求め、上記23式 から測定対象物1の放射率 ϵ と温度Tとを求めることが 40できる。このようにして求められた測定対象物1の放射 $oldsymbol{lpha} oldsymbol{\epsilon} oldsymbol{\epsilon}$ を上記 $oldsymbol{O}$ 式に代入することにより,測定対象物 $oldsymbol{1}$ の 温度Tを求めることができる。即ち、測定対象物1の放 射率 ε を補正する時は、参照熱源3を上下方向に移動し て、測定対象物1からの放射線をディテクタ2にて検出 する。また,測定対象物1の温度Tを測定する時は,参 照熱源3を取り外すか又は放射率 ε の補正時の放射線の 経路から十分離れた位置に参照熱源3を移動して、測定 対象物1からの放射線をディテクタ2にて検出する。上 記操作により測定対象物1の放射率εの補正と温度Tの※50

*項2記載の放射温度計。

【請求項4】 上記所定幅が可変である請求項2記載の 放射温度計。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は放射温度計に係り、詳し くは測定対象物の放射率変動を補正できる放射温度計用 光学系を備えた放射温度計に関するものである。 [0002]

【従来の技術】従来より非接触で測定対象物の温度を測 定する温度計の一つとして放射温度計が利用されてい る。図10は従来の放射温度計用光学系Aのの一例にお ける基本構成を示す模式図である。図10に示すよう に、この放射温度計用光学系Aoでは測定対象物1と、 測定対象物1からの放射線を検出するディテクタ2と, 測定対象物1とディテクタ2の間に移動自在に設けられ た半球状の参照熱源3とを具備している。参照熱源3の 内側は黒塗して黒体放射源となし、その頂上部に開口3 。が設けられている。この開口3。を通して測定対象物 1からの放射線がディテクタ2に到達する。参照熱源3 を一定温度に保持しつつ、参照熱源3のない状態Po, 参照熱源3の位置がP1, P2である状態の三状態にお いて測定対象物1からの放射線をディテクタ2にて検出 する。この時、検出される測定対象物1の見掛け上の輝 度L0 , L1 , L2 は次の通りとなる。

[0004]

-【発明が解決しようとする課題】上記のように、従来の 放射温度計用光学系Aοでは、測定対象物1の放射率ε を補正する度に、半球状の参照熱源3の移動や着脱を行 う必要がある。このため、参照熱源3の移動/着脱のた めの可動部が必要であった。又、参照熱源3の内部の温 度を均一化するための熱容量の大きい熱供給装置が必要 であった。従って、装置全体が大型となって、該装置の 取り付け場所の確保が困難となり且つ取扱上も不便であ った。本発明はこのような従来の技術における課題を解 決するために,放射温度計用光学系を改良し,参照熱源 を移動させることなく測定対象物の放射率変動を補正す ることができる小型の放射温度計を提供することを目的 とするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に第1の発明は,測定対象物に所定の角度から放射線を 放射する参照熱源と,上記参照熱源から放射された放射 線の上記測定対象物での反射方向に配置され,上記測定 対象物からの放射線をその見込む立体角の異なる複数の 焦点に集める反射結像手段と、上記反射結像手段の各焦

10

点に配置されて該反射結像手段により集められた放射線 を検出する放射検出手段と、上記放射検出手段により検 出された上記各焦点における放射線データに基づいて上 記測定対象物の放射率変動を補正する補正手段とを具備 してなることを特徴とする放射温度計として構成され る。また、第2の発明は、測定対象物に所定の角度から 所定幅の平行放射線を放射する参照熱源と、上記参照熱 源から放射された放射線の上記測定対象物での反射方向 に配置され、上記測定対象物からの放射線を集光して結 像させる反射結像手段と、上記反射結像手段の焦点に配 置されて該反射結像手段により集光された放射線をその 見込む立体角を変化させて受光する放射検出手段と、上 記放射検出手段により検出された上記放射線データに基 づいて上記測定対象物の放射率変動を補正する補正手段 とを具備してなることを特徴とする放射温度計として構 成される。更に、上記放射検出手段が、検出部の位置を 切り換えることのできる受光センサで構成されてなる放 射温度計である。更に、上記所定幅が可変である放射温 度計である。

[0006]

【作用】第1の発明によれば、参照熱源により測定対象 物に所定の角度から放射線が放射され、上記参照熱源か ら放射された放射線の上記測定対象物での反射方向に配 置された反射結像手段により該測定対象物からの放射線 がその見込む立体角の異なる複数の焦点に集められ、上 記反射結像手段の各焦点に配置された放射検出手段によ って、該反射結像手段により集められた放射線が検出さ れる。そして、上記放射検出手段により検出された上記 各焦点における放射線データに基づいて、補正手段によ り上記測定対象物の放射率変動が補正される。その結 果、上記参照熱源などの大物部品を移動させることなく 上記測定対象物の放射率変動を補正できる。第2の発明 によれば、参照熱源により測定対象物に所定の角度から 所定幅の平行放射線が放射され、上記参照熱源から放射 された放射線の上記測定対象物での放射方向に配置され た反射結像手段により該測定対象物からの放射線が集光 されて結像され、上記反射結像手段の焦点に配置された 放射検出手段によって、該反射結像手段により集光され た放射線がその見込む立体角を変化させられて受光され る。そして、上記放射検出手段により検出された上記放 射線データに基づいて、補正手段により上記検出手段に より上記測定対象物の放射率変動が補正される。この場 合も、上記参照熱源などの大物部品を移動させることな く上記測定対象物の放射率変動を補正できる。上記第2 の発明において"見込む立体角"を変化させる方法は種 々考えられるが、例えば検出手段として検出位置を変え ることのできる受光センサを用い、参照熱源からの平行 放射線がある幅を持つことから、上記受光センサの検出 位置を切り換えることにより検出される放射線の見込む 立体角を切り換えるようにしたり、上記平行放射線の幅 50

を切り換えることにより受光センサ上の受光面積を切り 換えるようにしてもよい。

[0007]

【実施例】以下、添付図面を参照して本発明を具体化し た実施例につき説明し、本発明(第1,第2の発明)の 理解に供する。尚、以下の実施例は、本発明を具体化し た一例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格の ものではない。ここに、図1は第1の発明の一実施例に 係る放射温度計用光学系AIの基本構成を示す模式図、 図2は第1の発明の他の実施例に係る放射温度計用光学 系A2の基本構成を示す模式図及びその構造図、図3は 第1の発明の他の実施例に係る放射温度計用光学系A3 の基本構成を示す模式図、図4は、第1の発明の他の実 施例に係る放射温度計用光学系A4 の基本構成を示す模 式図,図5は第1の発明の他の実施例に係る放射温度計 用光学系A5 の基本構成を示す模式図、図6は第2の発 明の一実施例に係る放射温度計用光学系A6 の基本構成 を示す模式図、図7は放射温度計用光学系A6 の焦電素 子の平面構造の一例を示す説明図、図8は放射温度計用 20 光学系A6 の焦電素子の平面構造の他の例を示す説明 図,図9は補促率計算用データを示すグラフである。 又,前記図10に示した従来の放射温度計用光学系Ao の基本構成を示す模式図と共通する要素には同一の符号 を使用する。

【0008】まず第1の発明の一実施例について説明す る。図1に示す如く,第1の発明の一実施例に係る放射 温度計用光学系A1は、例えばシリコンカーバイトを約 1000℃まで加熱することにより発生させた赤外線を 放射する参照熱源3′と、参照熱源3′から放射された 30 赤外線を通過させるか又は遮断するシャッタ5と、シャ ッタ5を通過した赤外線をチョッピングする第1のチョ ッパ6と、第1のチョッパ6によりチョッピングされた 赤外線を反射してその放射方向を測定対象物1に向ける と共に測定対象物1からの赤外線(反射成分及び放射成 分)を透過させるハーフミラー7と、ハーフミラー7を 通過した測定対象物1からの赤外線をその見込む立体角 の異なる各焦点に集光する反射鏡(反射結像手段に相 当) 4a, 4bと, 反射鏡4a, 4bの各焦点に配置さ れて反射鏡4。, 4。によりそれぞれ集光された赤外線 を検出する焦電素子(放射検出手段に相当) 2a , 2b 40 と, 焦電素子2。に入射する赤外線をチョッピングする 第2のチョッパ8と、焦電素子2a,2bにより検出さ れた赤外線データに基づいて測定対象物1の放射率εの 変動を補正する補正回路(補正手段に相当)9とから構 成されている。

【0009】以下、この光学系AIの動作について説明 する。まず、シャッタ5を開状態にし、第1のチョッパ 6を回転させる。この時、参照熱源3^{*}から測定対象物 1に向けて放射される赤外線には、第1のチョッパ6の 回転に応じた周期の強度変調が加えられる。強度変調が

加えられた赤外線は、ハーフミラー7により放射方向を 変えられて測定対象物1にその垂直方向から入射する。 そして、測定対象物1の表面で反射される。反射された 赤外線は、測定対象物1自体から放射された赤外線と共 に、ハーフミラー7を透過して反射鏡4a,4bに入射 する。反射鏡4a, 4bに入射した赤外線は、それぞれ 対応する焦点に集められる。そして、各焦点に配置され た焦電素子2』、2』により検出される。この時、焦電 素子2。, 26 の各出力(赤外線データ)を第1のチョ ッパ6の回転周期と比較(位相検波)することにより、 測定対象物1からの反射成分のみが検出される。

【0010】ところで、従来例においては、放射率 ϵ の 補正時に参照熱源3と測定対象物1との距離を変化させ ているが、この距離の変化は測定対象物1に入射された 放射線の測定対象物1での反射線の参照熱源3によって 捕らえられる割合である捕捉率 $F(1_1)$, $F(1_2)$ の比Rと差Dとを実験的に求めるためにディテクタ2に 入射される測定対象物 1 からの放射線量を変化させるこ とを目的としたものに他ならない。本実施例における反 射鏡4a, 4bの各焦点における赤外線の見込む立体角 の相異も従来例における参照熱源3と測定対象物1との 距離を変化させた結果と同様の効果を有する。従って, 上記見込む立体角の異なる少なくとも2箇所の焦点に設 けられた焦電素子2a,2bの出力から測定対象物1の 放射率 ϵ と温度Tとを求めることができる。即ち、測定 対象物 1 の放射率 & の補正時には、シャッタ5 を開状態 とし、且つ測定対象物1から入射される赤外線の見込む 立体角の異なる焦点にそれぞれ配置された焦電素子 2a, 2bの出力に基づいて、補正回路9により既述の **②③式を用いた演算を実行することにより放射率**εを求 30

【0011】このようにして参照熱源3′と測定対象物 1との距離を変えることなく測定対象物1の放射率 ϵ の 変動の補正を行うことができる。次に、シャッタ5を閉 状態にし、参照熱源3′からの赤外線が測定対象物1に 到達しないようにした上で、第2のチョッパ8を回転さ せる。この時、測定対象物1自体から放射された赤外線 のみが反射鏡4。により集められるが、途中第2のチョ ッパ8によりその回転に応じた周期の強度変調が加えら れる。強度変調を加えられた赤外線は、反射鏡4。の焦 点に配置された焦電素子2。により検出される。この時 の焦電素子2。の出力(赤外線データ)を第2のチョッ パ8の回転周期と比較(位相検波)することにより、測 定対象物1からの放射成分のみが検出される。測定対象 物1の放射率 ϵ は前述の補正時に求められているので、 この値を既述の①式に代入することにより測定対象物1 の温度Tを求めることができる。この演算も補正回路9 により実行することができる。本実施例では、上記のよ うにして従来例のように参照熱源を取り外したり移動さ せたりすることなく測定対象物1の放射率εの補正を行 50

めることができる。

うことができると共に、温度Tを求めることができる。 以上のように、上記実施例では、従来例におけるような 参照熱源の移動/着脱用の可動部及び参照熱源の内部の 温度を均一化するための熱容量の大きい熱供給装置が共 に不要であるため、装置全体を小型化できる。従って、 装置の取り付け場所の確保及び取り扱いが容易となる。 【0012】又、上記実施例では参照熱源3′から放射 される赤外線が測定対象物1に対して垂直方向から入射 するように,かつ測定対象物1から反射及び放射される 10 赤外線が反射鏡4。, 4。に入射するのを遮らないよう に、参照熱源3′と測定対象物1との間にハーフミラー 7を配置している。このため、反射鏡4a, 4b も測定 対象物1に対して垂直方向に配置することができ、参照 熱源3′を含めた装置全体としての光学系A1 がより小 型化されている。尚,参照熱源3~から放射され,測定 対象物1に入射する赤外線の照射径が十分に小さく(従 ってハーフミラー7が十分に小さく),測定対象物1か らの赤外線(反射成分及び放射成分)が反射鏡4。,4 ь に入射するのをハーフミラー7が遮る割合が小さい場 合は、ハーフミラー7のかわりにミラーを用いてもよ い。以下,第1の発明に係る他の実施例について説明す る。上記実施例では2対の反射鏡4a,4bと焦電素子 2。, 2。とを用いたが、図2に示す如く3対以上設け てもよい。即ち, 図2(a)は3対の反射鏡4a, 4b, 4c と焦電素子2a, 2b, 2c とを設けた例A 2 であり、測定対象物 1 の放射率 ε の変動補正時には焦 電素子2a, 2b, 2cが用いられ, 温度Tの測定時に は焦電素子2。のみが用いられる。この光学系A2 によ れば、赤外線の反射成分の角度分布をより確実に捕らえ ることができるため、放射率εの変動補正の精度を向上 させることができる。この光学系A2 のようにたとえる 対の反射鏡4a , 4b , 4c と焦電素子2a, 2b , 2 。とを設けた場合でも、従来例の如き参照熱源などの大 物部品の可動部を有しない限り、図2(b)に示すよう に装置全体を集約して小型化することができる。 【0013】又,上記光学系A1, A2では,2対以上 の反射鏡4a, 4b, (4c)と焦電素子2a, 2b, (2。)とを用いたが、図3~図5に示す如く、反射鏡 を1台にすることもできる。図3(a)は1台の反射鏡 4。に2個の焦点を直列に配した例A3である。即ち, 図3(a)の反射鏡4。は入射する赤外線に対して2つ の異なる立体角を有する例であり、図3(b)に示すよ うな同心円状の2つの異なる曲率を有する凹面鏡で構成 されている。この光学系A3 によれば反射鏡4a が1台 ですむため、更に装置の小型化を図ることができる。図 4及び図5は1台の反射鏡4。に2個の焦点を直列にな らないように配した例A4 , A5 である。即ち、図4の 反射鏡4。は入射する赤外線に対して2つの異なる反射 方向を有する例であり、局部的に反射方向を変えた凹面

鏡で構成されている。図5 (a)の反射鏡4a は入射す

る赤外線に対して2つの異なる反射方向及び立体角を有 する例であり、図5(b)に示すような曲率の異なる2 種類の半円状の凹面鏡の組み合せにより構成されてい る。これらの光学系A4 , A5 によれば, 焦電素子2a 及び焦電素子2。を、測定対象物1から反射鏡4。に向 かう赤外線を互いに遮らない位置におけるように、凹面 鏡の向き及び/又は立体角を選択することができる。従 って、測定対象物1から反射鏡4。に向かう赤外線が焦 電素子2。, 2。に遮られることがなくなるので赤外線 の検出効率を上げることができる。尚、上記光学系A3 ~A5 では説明の便宜上、参照熱源3′から放射される 赤外線を測定対象物1に対して斜め方向から入射させて おり、又チョッピングを行っていないが、実使用に際し ては前記光学系A1, A2 の如くハーフミラー7(又は ミラー)を用いて赤外線を測定対象物1に対して垂直方 向から入射させ、又第1のチョッパ6及び第2のチョッ パ8を用いて赤外線をチョッピングしても何ら支障はな い。尚, 上記光学系A1 ~A5 では, 参照熱源3′から 放射される赤外線を遮断するためにシャッタラを使用し ているが、実使用においては、参照熱源3′自体の加熱 を止めても何ら支障はない。尚,上記光学系A1 ~ A5 では、焦電素子2a, 2b(2c)を反射鏡4a, (4 b), (4c)の焦点の数だけ設けたが、実使用に際し ては1台の焦電素子2。を各焦点の位置に移動させても 何ら支障はない。

【0014】引き続いて、第2の発明の一実施例につい て説明する。図6に示す如く、第2の発明の一実施例に 係る放射温度計用光学系As は、例えばシリコンカーバ イトを約1000℃まで加熱することにより発生させた ある幅 (所定幅)を持った平行赤外線を放射する参照熱 30 源3′と、参照熱源3′から放射された赤外線を通過さ せるか又は遮断するシャッタ5と、シャッタ5を通過し た赤外線をチョッピングする第1のチョッパ6と,第1 のチョッパ6によりチョッピングされた赤外線を反射し てその放射方向を測定対象物 1 に向けると共に測定対象 物1からの赤外線(反射成分及び放射成分)を透過させ るハーフミラー7と、ハーフミラー7を通過した測定対 象物1からの赤外線を焦点に集光して結像させる反射鏡 (反射結像手段に相当) 4′と, 反射鏡4′の焦点に配 置されて反射鏡4′により集光された赤外線を検出する 焦電素子(放射検出手段に相当)2′と,焦電素子2′ に入射する赤外線をチョッピングする第2のチョッパ8 と、焦電素子2′により検出された赤外線データに基づ いて測定対象物1の放射率εの変動を補正する補正回路 (補正手段に相当) 9とから構成されている。 具体的 には、反射鏡4′として長軸半径300㎜、離心率0. 5の回転楕円体を長軸に垂直な面で切断した楕円面鏡を 用いる。すると反射鏡4′の中心から2つの焦点までの 距離はそれぞれ150mm, 450mmとなる。この2つの 焦点をそれぞれ f 1 , f 2 とする。 焦点 f 1 に 焦電素子 50

2′を焦点f²に測定対象物1をおく。反射鏡4′の大きさは測定対象物1からの反射を鏡面反射方向から20°までを検出できる大きさとする。測定対象物1に照射する赤外線の照射径は半径5mmとする。図7に焦電素子2′の構成を示す。焦電素子2′は内側に位置する半径1mmの円形上の素子2。′と外側に位置する内半径1ミリ、外半径2mmの環状の素子2。′とで構成され、それぞれ独立に出力を取り出すことができる。以下、この光

【0015】まず、シャッタ5を開状態にし、参照熱源

1′がハーフミラー7に向けて赤外線を平行光として放

学系A6 の動作について説明する。

8

射する。放射された赤外線はハーフミラー7で反射され 測定対象物1に垂直方向から入射する。入射された赤外 線は、測定対象物1で反射される。この反射された赤外 線は、測定対象物1自体から放射された赤外線と共にハ ーフミラー7を透過して反射鏡4°に入射され、焦点f 1 に配置された焦電素子2′(2a′, 2b′)にそれ ぞれその見込む立体角を変化させて集光される。ところ で、従来例においては、放射率εの補正時に参照熱源3 と測定対象物1との距離を変化させているが、この距離 の変化は前記20,3式中の捕捉率F(11),F (12)の比Rと差Dとを実験的に求めるためにディテ クタ2に入射される測定対象物1からの放射線量を変化 させることを目的としたものに他ならないという点は前 述の通りである(参考として,周知の光線追跡法によっ て反射の計算機シミュレーションを行った結果から、比 Rおよび差Dを計算した結果を図9に示す。ただし、図 中Rs,Rhは測定対象物1表面での反射を周知の鏡面 拡散モデルで表した時の鏡面反射成分、拡散反射成分を 示す)。本実施例では、参照熱源3~からの赤外線に幅 を持たせ、ある面積をもつスポット光として照射するこ とにより、この幅に伴う赤外線の見込む立体角を発生さ せる。そして、赤外線の検出位置の異なる焦電素子 2。′, 2。′を切り換えることにより出力される上記 赤外線の見込む立体角を切り換えることができるため、 従来例における参照熱源3と測定対象物1との距離を変 化させた結果と同様の効果を有する。従って,焦電素子 2。′, 2。′の出力から測定対象物1の放射率 ε と温 度Tとを求めることができる。即ち,測定対象物1の放 射率 ϵ の補正時には、シャッタ5を開状態とし、且つ測 定対象物1から入射される赤外線のそれぞれ見込む立体 角の異なる焦電素子2。′,2。′の出力に基づいて、 補正回路9により既述の②③式を用いた演算を実行する ことにより放射率 ϵ を求めることができる。

【0016】このようにして参照熱源3、と測定対象物1との距離を変えることなく測定対象物1の放射率 ϵ の変動の補正を行うことができる。次に、シャッタ5を閉状態にし、参照熱源3、からの赤外線が測定対象物1に到達しないようにした上で、測定対象物1自体から放射された赤外線のみを反射鏡4、で集光し焦電素子2。

で検出する。測定対象物1の放射率をは前述の補正時に 求められているので、この値を既述の①式に代入することにより測定対象物1の温度Tを求めることができる。 この演算も補正回路9により実行することができる。本 実施例では、上記のようにして従来例のように参照熱源 を取り外したり移動させたりすることなく測定対象物1 の放射率をの補正を行うことができると共に、温度Tを 求めることができる。以上のように、本実施例でも第1 の発明の各実施例と同様、従来例におけるような参照熱源の移動/着脱用の可動部及び参照熱源の内部の温度を 均一化するための熱容量の大きい熱供給装置が共に不要 であるため、装置全体を小型化できる。従って、装置の 取り付け場所の確保及び取り扱いが容易となる。

【0017】尚、上記実施例では第1、第2のチョッパ 6,8の説明を省略したが、これらは前述した光学系A 1 におけるものと同様に作動する。以下,第2の発明に 係る他の実施例について説明する。上記実施例では特殊 形状の焦電素子2′(2a′, 2b′)を用いたが、市 販の素子を用い、これを反射鏡4´の焦点f:に複数並 べてもよい。例えば、焦電素子の受光面を図8に示すよ うに、5m×5mの正方形とし、0.5m×0.5mの 素子100個で構成されるとする。この100個の素子 を2群に分割し、それぞれの出力の和を用いる。即ちこ れらの焦電素子は実質的には境界を自由に変更可能な二 つの素子として使用することができる。境界が自由に変 更できるという利点があるので、測定対象物での赤外線 の反射特性がその反射方向に大きく依存するような測定 対象物に対しても適用可能である。又、上記実施例では 複数の焦電素子2′(2a′, 2b)を用いたが、この 他にも赤外線の見込む立体角を変化させる方法は種々考 えられる。例えば、参照熱源3′から放射される赤外線 の幅を、例えばシャッタ5を開度調整することにより可 変とし、この幅を変化させることによっても焦点 f: に おける赤外線の見込む立体角を任意に変えることができ る。その場合は焦電素子は赤外線の幅に見合う十分な受 光面積を持つ受光素子を1つだけ設ければよく、装置が 簡略化できる。更に、上記実施例では複数の焦電素子 2′(2a′,2b′)を用いたが、焦電素子を1だけ 設けて、これを移動可能とすることによっても同様の効 果が得られる。

[0018]

【発明の効果】本発明に係る放射温度計は上記したように構成されているため、参照熱源などの大物部品を移動させることなく測定対象物の放射率を補正することができる。従って、参照熱源の移動/着脱用の可動部を設ける必要がなく、又参照熱源の内部の温度を均一化するための熱容量の大きい熱供給装置も不要であることから、装置全体の小型化を図ることができる。その結果、装置の取り付け場所の確保及び取り扱いが容易となる。

10

10 【図面の簡単な説明】

【図1】 第1の発明の一実施例に係る放射温度計用光 学系A1 の基本構成を示す模式図。

【図2】 第1の発明の他の実施例に係る放射温度計用 光学系A2 の基本構成を示す模式図及びその構造図。

【図3】 第1の発明の他の実施例に係る放射温度計用 光学系A3 の基本構成を示す模式図。

【図4】 第1の発明の他の実施例に係る放射温度計用 光学系A₄ の基本構成を示す模式図。

【図5】 第1の発明の他の実施例に係る放射温度計用 20 光学系A5 の基本構成を示す模式図。

【図6】 第2の発明の一実施例に係る放射温度計用光 学系A6 の基本構成を示す模式図。

【図7】 放射温度計用光学系A6 の焦電素子の平面構造の一例を示す説明図。

【図8】 放射温度計用光学系A6 の焦電素子の平面構造の他の例を示す説明図。

【図9】 捕促率計算用データを示すグラフ。

【図10】 従来の放射温度計用光学系A₀ の一例における基本構成を示す模式図。

30 【符号の説明】

A1 ~ A6 …放射温度計用光学系

1…測定対象物

2a, 2b …焦電素子(放射検知手段)

2′(2 a′, 2 b′)…焦電素子(放射検出手段としての受光センサ)

3′…参照熱源

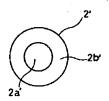
40

4a, 4b…反射鏡(反射結像手段)

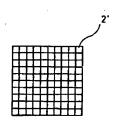
4′…反射鏡(反射結像手段)

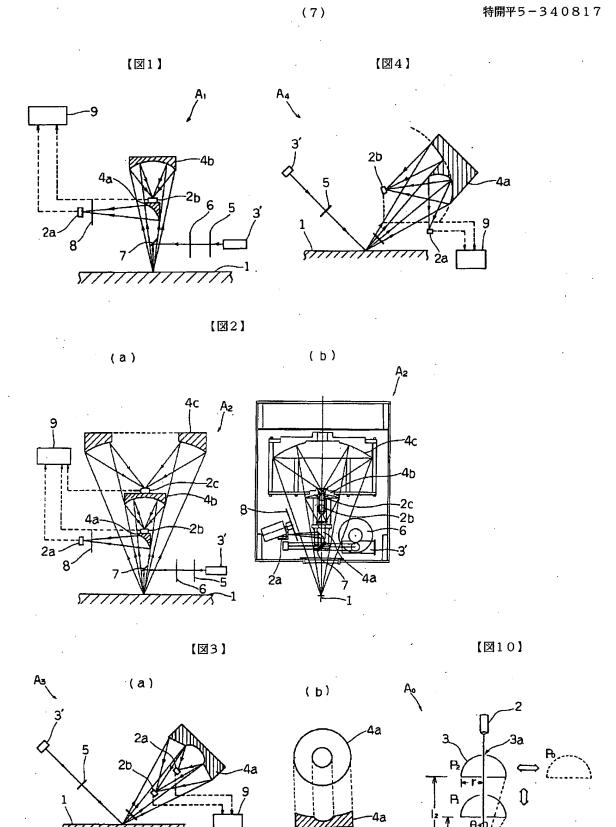
9…補正回路(補正手段)

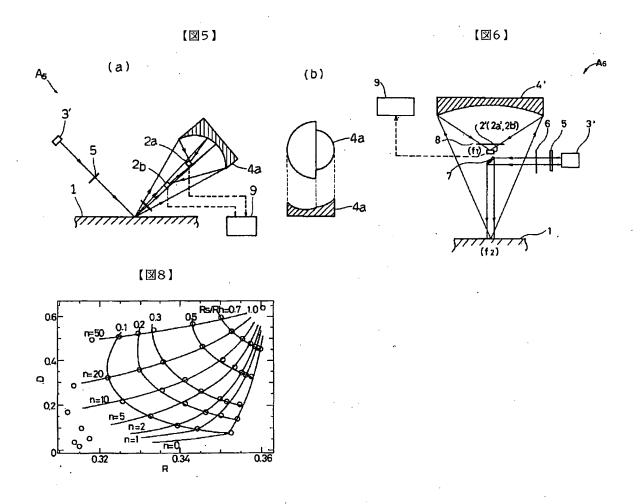
【図7】



【図9】







フロントページの続き

(72)発明者 新井 明男 兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号 株式会社神戸製鋼所西神総合研究地区内 (72) 発明者 鈴木 紀生 兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号 株式会社神戸製鋼所西神総合研究地区内